Магнитные и электрические свойства халькопирита ZnGeAs₂: Mn

© Л.И. Королева, В.Ю. Павлов, Д.М. Защиринский, С.Ф. Маренкин*, С.А. Варнавский*, Р. Шимчак**, В. Добровольский**, Л. Киллинский**

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

119992 Москва, Россия

* Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук,

119991 Москва, Россия

** Институт физики Польской академии наук,

02668 Варшава, Польша

E-mail: koroleva@phys.msu.ru

(Поступила в Редакцию 12 февраля 2007 г.)

При легировании полупроводника ZnGeAs2 марганцем получены составы со спонтанной намагниченностью и высокими значениями температуры Кюри, достигающими 367 К в составе с 3.5 wt.% Мп. Их магнитные свойства характерны для спиновых стекол (CC) при температурах $T < T_S$ и магнитных полях H < 11 kOe. В более сильных полях состояние СС заменяется фазой со спонтанной намагниченностью, величина которой в 20-30 раз меньше той, которая была бы при ферромагнитном (ФМ) упорядочении всех ионов Mn. Очевидно, это одоносвязная ФМ-фаза, в которой расположены области с фрустрированными связями. Фрустрированные области и фаза СС содержат невзаимодействующие ФМ-кластеры, так как в этих областях и фазе СС при низких Т наблюдается резкое возрастание намагниченности М, при этом зависимость M(T) описывается функцией Ланжевена. Измерения удельного электросопротивления ρ и эффекта Холла показали, что при $T < 30\,\mathrm{K}$ величина ρ составов с 1.5 и 3.5 wt.% Мл выше, чем при 30 К, что обеспечивает преобладание сверхобмена и осуществление состояния СС. Из-за неравномерного распределения ионов Mn в фазе CC имеются изолированные ФМ-кластеры, ферромагнетизм в которых осуществляется обменом через носители заряда. С дальнейшим ростом Т происходит более быстрое возрастание подвижности, чем падение концентрации, что обеспечивает усиление обмена через носители заряда и рост размеров Φ М-кластеров, которые при $T = T_S$ приходят в соприкосновение. Происходит переход от многосвязной ФМ-фазы к односвязной ФМ-фазе, внутри которой располагаются микрообласти с фрустрированными связями.

PACS: 75.50.Pp, 75.50.Lk, 72.25.-b

Начиная с 90-х годов активно развивается новое направление физики твердого тела, связанное с возможностью переноса ориентированного спина электрона из ферромагнетика в немагнитный полупроводник [1,2]. Прикладное направление этих исследований получило название спинтроники. Эти исследования важны для создания одноэлектронных логических структур и спининформационных систем для информатики (в данном случае спиновой информатики, в которой информационной ячейкой памяти служит спин электрона: один спин — один бит информации [3]). В твердотельной электронике спиновый токоперенос открывает новую возможность управления магнитным полем характеристиками различных устройств — диодов, триодов и т.д., т.е. появляется дополнительная степень свободы. Использование в качестве эмиттеров поляризованных спинов ферромагнитных (ФМ) металлов дает степень спиновой поляризации не более 10%. Значительно более высокая степень поляризации (до 100%) была получена в структурах полупроводник-EuO и полупроводникхалькогенидные шпинели, но при криогенных температурах, что неудобно для практических приложений. Кроме того, в этом случае возникает технологическая проблема создания хорошего электрического контакта между ферромагнетиком и полупроводником.

Получить хороший электрический контакт и высокую степень поляризации по спину тока можно, создав ФМ-полупроводник с температурой Кюри выше комнатной путем легирования примесями с неполностью заполненными 3*d*-оболочками. Именно поэтому внимание исследователей сосредоточилось на создании ФМ-полупроводника путем легирования марганцем широко используемых в микроэлектронике полупроводников, в первую очередь соединений $A^{III}B^V$. Наиболее изученным представителем этого класса материалов является $Ga_{1-x}Mn_xAs$, в котором был обнаружен ферромагнетизм с температурой Кюри T_C , не превышающей 170 К [4,5].

Недавно высокотемпературный ферромагнетизм был обнаружен в халькопиритах $A^{II}B^{IV}C_2^V$, легированных Mn. Это были соединения CdGeP₂: Mn [6], ZnGeP₂: Mn [7] и ZnSnAs₂: Mn [8], в которых точка Кюри достигала 350 К. В нашей работе [9] описано соединение CdGeAs₂: Mn, в котором температура Кюри $T_{\rm C}$ была еще выше — 355 К.

Тройные полупроводники $A^{II}B^{IV}C_2^V$ известны давно. Эти соединения являются кристаллохимическим и электронным аналогом полупроводников $A^{III}B^V$. Интерес к ним возник после того, как в них были обнаружены уникальные нелинейные оптические свойства: высокие значения нелинейной поляризуемости и двулучепреломления, что позволяет использовать их для параметрического преобразования частоты лазерного излучения среднего ИК-диапазона. Для этой цели наиболее перспективными являются высокочистые кристаллы CdGeP₂, CdGeAs₂ и ZnGeP₂. Основные особенности, характеризующие соединения A^{IIBV} , сохраняются и у соединений типа $A^{II}B^{IV}C_2^V$, а именно преимущественно ковалентный тип связи; малые эффективные массы носителей заряда, относительно высокие подвижности электронов и дырок; сохранение абсолютных минимумов и максимумов зоны проводимости и валентной зоны в центре зоны Бриллюэна.

В нашей работе получены и исследованы новые соединения ZnGeAs₂ : Мп, температура Кюри которых достигает 367 К — рекордной величины для соединений типа $A^{II}B^{IV}C_2^{V}$. Рассматриваемое в нашей работе соединение ZnGeAs₂ обладает следующими характеристиками: ширина запрещенной зоны 0.85 eV; значения подвижности $\sim 10^2$ cm²/V · s (для дырок с концентрациями $10^{18}-5\cdot10^{19}$ cm⁻³); эффективная масса дырок 0.4–0.74. Таким образом, соединения $A^{II}B^{IV}C_2^{V}$: Мп являются перспективными материалами спинтроники.

1. Техника эксперимента

В данной работе изучены намагниченность, электросопротивление ρ , магнитосопротивление $\Delta \rho / \rho = (\rho_H - \rho_{H=0}) / \rho_{H=0}$ и эффект Холла поликристаллических образцов ZnGeAs₂ : Mn с содержанием Mn от 1.5 до 3.5 wt.%. Намагниченность измерялась с помощью СКВИД-магнитометра. Для измерения ρ и $\Delta \rho / \rho$ использовался четырехзондовый метод. Эффект Холла измерялся стандартным методом на постоянном токе. Контакты к образцам были сделаны с помощью токопроводящего клея.

2. Результаты эксперимента и их обсуждение

Образцы ZnGeAs₂ были получены непосредственным сплавлением высокочистых порошков ZnAs2 и Ge, взятых в стехиометрическом соотношении. Мп вводили согласно гипотетическому разрезу ZnGeAs2-MnGeAs2. Для увеличения растворимости Mn скорость охлаждения от 900°C выбиралась не ниже чем 5-10 K/s. Рентгенофазовый анализ показал, что все образцы с содержанием Mn 1.5, 3 и 3.5 wt.% были однофазны и идентифицировались как ZnGeAs₂. Сравнение параметров кристаллической решетки показало, что с ростом содержания Mn объем элементарной ячейки уменьшается, что, по-видимому, указывает на образование твердых растворов путем замещения Zn на Mn. Содержание компонентов контролировалось с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. Изучение распределения элементов по длине образцов показывает, что соотношение



Рис. 1. Температурная зависимость намагниченности M состава. ZnGeAs₂ с 3.5 wt.% Mn, измеренная в магнитном поле 50 kOe и в поле 0.6 kOe (на вставке). ZFC-кривая — образец охлаждался в отсутствие магнитного поля от температуры 400 до 5 K и затем при нагревании измерялась его намагниченность; FC-кривая — образец охлаждался в магнитном поле 0.6 kOe от 400 до 5 K, при этом измерялась его намагниченность.

Zn:Ge:As = 1:1:2. Мп распределялся по длине образца равномерно в пределах ошибки обнаружения.

На рис. 1 показана температурная зависимость намагниченности M(T) состава с 3.5 wt.% Mn в магнитном поле H = 50 kOe. Как видно, кривая M(T) при $T > 60 \, {\rm K}$ характерна для ферромагнетика. Однако при T < 60 К наблюдается резкое возрастание намагниченности с понижением температуры, которое может быть интерпретировано как дополнительный вклад от суперпарамагнитной фазы. На вставке к рис. 1 показана зависимость M(T) в слабом магнитном поле 600 Ое. Видно резкое различие кривых M(T), измеренных в сильном (50 kOe) и слабом (0.6 kOe) полях. В слабом поле при понижении температуры ниже $T_S = 86 \, {\rm K}$ наблюдается резкое падение намагниченности, при этом величина M уменьшается в 4.5 раза. При $T_k \sim 10 \,\mathrm{K}$ это падение прекращается, и в районе T_k существует разница между намагниченностями образца, охлажденного от $T > T_{\rm C}$ в этом слабом магнитном поле (FC-кривая) и охлажденного без поля (ZFC-кривая). На FC-кривой виден подъем при дальнейшем понижении температуры. На рис. 2 приведены кривые M(T) в области температур, включающих T_S , измеренные в магнитных полях 3, 6, 8, 9 и 11 kOe. Как видно из этого рисунка с увеличением Н падение намагниченности при $T = T_S$ становится менее резким и при 11 kOe пропадает, а сама величина T_S смещается к более низким температурам. Так, при увеличении поля от 600 Oe до 9 kOe величина T_S уменьшается от 86 до 49 К. В то же время подъем на кривых M(T)при $T < T_k$ проявляется все сильнее с ростом H. На рис. 3 приводятся петли гистерезиса FC- и ZFC-образца при 5К. Видно смещение петли FC-образца по оси Н. Подобное поведение намагниченности наблюдалось у других исследованных составов этой системы, при этом описанные выше особенности становились менее выраженными с уменьшением содержания марганца.

Описанное поведение намагниченности указывает на то, что при $T = T_S$ происходит переход от состояния со



Рис. 2. Температурная зависимость намагниченности M состава ZnGeAs₂ с 3.5 wt.% Mn, измеренная в разных магнитных полях в температурном интервале от 5 до 100 K. Каждая кривая измерялась после охлаждения образца до 5 K в отсутствие магнитного поля.



Рис. 3. Центральная часть петли гистерезиса образца $ZnGeAs_2 c 3.5 wt.\% Mn$, измеренной при 5 K в магнитном поле от +0.6 до -0.6 kOe. Видно смещение петли по оси *H* для образца, охлажденного до 5 K в магнитном поле 0.6 kOe, в то время как для образца, охлажденного в отсутствие поля, она симметрична.



Рис. 4. Изотермы намагниченности образца ZnGeAs₂ с 3.5 wt.% Mn, измеренные при различных температурах. Каждая кривая измерялась после охлаждения образца до 5 К в отсутствие магнитного поля.

спонтанной намагниченностью к состоянию спинового стекла (CC), т.е. наблюдается возвратное к состоянию CC поведение. Это CC содержит невзаимодействующие магнитные кластеры, так как зависимость M(T) при $T < T_k$ подчиняется функции Ланжевена. Переход при $T = T_S$ не может быть переходом ферромагнетик–антиферромагнетик, так как он исчезает в относительно слабом поле, а сама величина T_S зависит от магнитного поля. Кроме того, как видно из рис. 4, зависимость M(H) при $T < T_S$ нелинейна вплоть до максимальных полей 50 kOe; если бы при $T < T_S$ имел место антиферромагнетизм, то эта зависимость была бы линейной.

Интересно также выяснить, что представляет собой фаза со спонтанной намагниченностью при $T < T_S$. В цитированных выше работах [4-9] фаза со спонтанной намагниченностью в разбавленных магнитных полупроводниках типа $A^{II}B^{IV}C_2^V$ и $A^{III}B^V$, легированных Мп, называлась "ферромагнитной", несмотря на то что экспериментально определенный в них магнитный момент на ион Мп при гелиевых температурах был много ниже предельного значения 5 µ_B. В составе ZnGeAs₂ с 3.5 wt.% Mn, магнитные свойства которого описаны выше, величина магнитного момента на ион Mn (μ_s) оказалась равной $\sim 1\,\mu_{\rm B}$. Она была определена из намагниченности M_S, полученной путем экстраполяции почти прямолинейной части кривой M(T), измеренной в поле 50 kOe, до пересечения с осью M. Эта величина μ_s в 4-5 раз меньше магнитных моментов ионов Mn^{3+} и Mn²⁺, вследствие чего можно предположить, что большая часть объема "ферромагнитной" фазы занята областями с фрустрированными связами. Примерно такие же значения µ_s были получены для других составов рассматриваемой системы. Из указанного выше можно сделать вывод, что вплоть до максимальных полей измерения (50 kOe) поведение намагниченности имеет сложный характер. При $T < T_S$ и $H \le 9 \,\mathrm{kOe}$



Рис. 5. Температурная зависимость удельного электросопротивления ρ и нормального коэффициента Холла R_h состава ZnGeAs₂ с 1.5 wt.% Mn.

имеет место состояние СС; в более сильных магнитных полях оно заменяется односвязной ФМ-фазой, в которой расположены области с фрустрированными связями. Фрустрированные области содержат невзаимодействующие суперпарамагнитные кластеры. Очевидно, понятие температуры Кюри такой системы весьма условно: это температура Кюри односвязной ФМ-фазы. Ее определение невозможно методом термодинамических коэффициентов Белова-Арротта из-за магнитной неоднородности системы. Неправомерно определение ТС и по намагниченности в слабых магнитных полях, так как эта намагниченность обусловлена размагничивающим фактором. Размагничивающий фактор односвязной ФМ-фазы зависит от ее конфигурации, которая меняется с температурой. Поэтому в качестве температуры Кюри была взята температура, полученная путем экстраполяции наиболее крутой части кривой M(T), измеренной в максимальном поле (50 kOe), до ее пересечения с осью температур. Температура Кюри оказалась равной 367 К. Это самая высокая температура Кюри в системах А^{II}В^{IV}С^V₂ : Мп. Тем самым были подтверждены выводы теоретической работы [10] о том, что температуры Кюри Zn-содержащих халькопиритов выше, чем соответствующих Сd-содержащих.

Наблюдалась линейная зависимость электрического поля Холла рассматриваемых образцов от магнитного поля, что указывает на отсутствие аномального эффекта Холла. Измерения удельной электропроводности и эффекта Холла показали, что все образцы обладают дырочным типом проводимости с концентрацией дырок $p \sim 10^{19} - 10^{20} \,\mathrm{cm^{-3}}$ и подвижностью от 0.25 до 2.5 сm² · V⁻¹ · s⁻¹. На рис. 5, 6 проводит-

ся температурная зависимость удельного электросопротивления ρ , нормального коэффициента Холла R_H и подвижности. Видно, что у состава с 1.5 wt.% Мп зависимость $\rho(T)$ имеет полупроводниковый характер, однако зависимость p(T) — металлический, при этом величина p меняется очень мало: от $6.4 \cdot 10^{19}$ сm⁻³ при T = 50 K до $5.2 \cdot 10^{19}$ сm⁻³ при 300 K. Подвижность возрастает быстрее: от 1.25 сm² · V⁻¹ · s⁻¹ при 20 K до 2.6 сm² · V⁻¹ · s⁻¹ при 300 K. У состава с 3.5 wt.% Мп зависимость $\rho(T)$ имеет минимум при $T \sim 30$ K и подвижность возрастает на порядок в области $10 \le T \le 300$ K, тогда как p изменяется от $2.5 \cdot 10^{20}$ сm⁻³ при 50 K до $8 \cdot 10^{19}$ сm⁻³ при 300 K. Магнитосопротивление мало: оно не превышает 4% при H = 8 kOe.

Происхождение ферромагнетизма в разбавленных магнитных полупроводниках было исследовано при вычислении электронной структуры из первых принципов [11,12]. В этих работах утверждалось, что эффективное обменное взаимодействие в них определяется в основном конкуренцией между двойным обменом и сверхобменными взаимодействиями. Известно, что полупроводники со структурой халькоперита стабилизируются некоторыми внутренними дефектами, являющимися источником дырок, которые образуют стабильные комплексы с Mn [13]. Следует заметить, что при двойном обмене происходит переход носителей заряда между разновалентными ионами, в данном случае между ионами Mn²⁺ и Mn³⁺. Как было показано выше, в рассматриваемой системе Mn замещает Zn, вследствие чего такими комплексами являются (Zn, V_C, Mn), где V_C — вакансии. При этом неизвестно, как вакансии влияют на распределение ионов Mn²⁺ и Mn³⁺. Поэтому далее мы заменяем



Рис. 6. Температурная зависимость удельного электросопротивления ρ и подвижности дырок состава ZnGeAs₂ с 3.5 wt.% Mn.

термин "двойной обмен" на более широкое понятие "обмен через носители тока". Как видно из рис. 5 и 6, при *T* < 30 K удельное электросопротивление составов с 1.5 и 3.5 wt.% выше, чем при 30 К, что, по-видимому, обеспечивает преобладание сверхобмена. Как показано в [14], в этом случае основным состоянием является состояние СС. С дальнейшим ростом температуры происходит более быстрое возрастание подвижности, чем небольшое падение концентрации, что обеспечивает преобладание обмена через носители заряда, и происходит переход от спин-стеклообразного к ФМ-состоянию. Возможен и другой сценарий, основанный на близости энергий сверхобмена и обмена через носители заряда, который не противоречит наблюдаемым магнитным и транспортным свойствам. Так как при растворении в ZnGeAs₂ ионы Mn располагаются случайно, при низких температурах в матрице, состоящей из СС, возможны ФМ-кластеры, ферромагнетизм в которых обеспечен преобладанием энергии обмена через носители заряда внутри них. С повышением температуры объем этих кластеров растет в основном из-за увеличения подвижности дырок, и при некоторой температуре эти кластеры приходят в соприкосновение. Происходит переход от многосвязной ФМ-фазы, состоящей из изолированных ФМ-кластеров, к односвязной ФМ-фазе, внутри которой располагаются микрообласти с фрустрированными связями.

Список литературы

- [1] H. Ohno. Science 281, 951 (1998).
- [2] G.A. Prinz. Science 282, 1660 (1998).
- [3] F. Matsukura, H. Ohno, A. Shen, Y. Sugawara. Phys. Rev. B 57, R 2037 (1998).
- [4] K.M. Edmonds, K.Y. Wang, R.P. Campion, A.C. Neumann, N.R.S. Farley, B.L. Gallagher, C.T. Foxon. Appl. Phys. Lett. 81, 4991 (2002).
- [5] K.M. Edmonds, P. Boguslawski, K.Y. Wang, R.P. Campion, S.N. Novikov, N.R.S. Farley, B.L. Gallagher, C.T. Foxon, M. Sawicki, T. Dietl, M. Buongiorno Nardelli, J. Bernholc. Phys. Rev. Lett. **92**, 03 720 (2004).
- [6] G.A. Medvedkin, T. Ishibashi, T. Nishi, K. Hayata, Y. Hasegawa, K. Sato. Jpn. J. Appl. Phys. 39, L 949 (2000).
- [7] G.A. Medvedkin, K. Hirose, T. Ishibashi, T. Nishi, V.G. Voevodin, K. Sato. J. Cryst. Growth 236, 609 (2002).
- [8] S. Choi, G.-B. Cha, S.C. Hong, S. Cho, Y. Kim, J.B. Ketterson, S.-Y. Jeong, G.-C. Yi. Solid State Commun. **122**, 165 (2002).
- [9] Р.В. Демин, Л.И. Королева, С.Ф. Маренкин, С.Г. Михайлов, В.М. Новоторцев, В.Т. Калинников, Т.Г. Аминов, Р. Шимчак, Г. Шимчак, М. Баран. Письма в ЖТФ **30**, 81 (2004).
- [10] P.R. Kent, T.C. Schulthess. In: 27th Int. Conf. on Physics of Semiconductors / Eds J. Menendez, Ch.G. Van de Walle (2005). P. 1369.
- [11] H. Akai. Phys. Rev. Lett. 81, 3002 (1998).
- [12] H. Akai, T. Kamatani, S. Watanabe. J. Phys. Soc. Jpn. (Suppl.) A 69, 112 (2000).
- [13] P. Mahadevan, A. Zunger. Phys. Rev. Lett. 88, 047 205 (2002).
- [14] Y.-J. Zhao, W.T. Geng, A.J. Freeman, T. Oguchi. Phys. Rev. B 63, R 201 202, (2001).